

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	(3)
Abstract	(4)
กิตติกรรมประกาศ	(5)
สารบัญ	(6)
รายการตาราง	(8)
รายการภาพประกอบ	(10)
บทที่	
1 บทนำ	1
บทนำต้นเรื่อง	1
การตรวจเอกสาร	8
วัตถุประสงค์	40
2 วิธีการวิจัย	41
สารคดีและวัสดุ	41
อุปกรณ์และเครื่องมือ	42
วิธีดำเนินการ	45
การสัมภาษณ์ทับทิม	45
การศึกษาคุณภาพวิเคราะห์และปริมาณวิเคราะห์ของโครงเมียม	
ในทับทิมสัมภาษณ์	53
การศึกษาคุณลักษณะของทับทิม	62

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
3 ผลการวิจัย	68
การสั่งเคราะห์ทับทิม	68
การศึกษาคุณภาพวิเคราะห์และปริมาณวิเคราะห์ของครัวเมือง	
ในทับทิมสั่งเคราะห์	72
การศึกษาคุณลักษณะของทับทิม	110
4 บทวิจารณ์	118
5 บทสรุป	135
บรรณานุกรม	137
ภาคผนวก	144
ประวัติผู้เขียน	172

รายการตาราง

ตารางที่	หน้า
1 แสดงสมบัติทางกายภาพของโลหะอะลูมิเนียม	1
2 แสดงข้อมูลทางเอกซ์เรย์ของคอร์นดัม	10
3 แสดงโครงสร้างของ aluminium oxides และ hydroxides	11
4 แสดงการเรียกชื่อผลึกของ Hydrates alumina	12
5 แสดงลักษณะผลึกและสมบัติทางฟิสิกส์ของ Hydroxides และ Oxide of Aluminum	14
6 แสดงองค์ประกอบทางเคมีของแร่บอกไซด์	15
7 แสดงองค์ประกอบทางเคมีของอลูมินาที่มีคุณภาพดี	19
8 แสดงตัวอย่างครูซิเบิลและอุณหภูมิสูงสุดของครูซิเบิลแต่ละชนิด	26
9 แสดงวิธีการผลิตทับทิมสังเคราะห์และบริษัทผู้ผลิต	31
10 แสดงค่าความถ่วงจำเพาะของคอร์นดัม	39
11 แสดงค่าสัญญาณภายในตัวอย่างผง	72
12 แสดงค่าสัญญาณภายในตัวอย่างเม็ด	73
13 แสดงน้ำหนักจริงของสารมาตรฐานที่ซึ่งได้	77
14 แสดงความเข้มข้นจริงของสารมาตรฐาน	77
15 แสดงการทดสอบความหนาในตัวอย่างเม็ดทับทิมสังเคราะห์	81
16 แสดงการทดสอบความหนาในตัวอย่างผง	82
17 แสดงความเข้มข้นของครามียมออกไซด์ของผงสารตั้งต้น	89
18 แสดงความเข้มข้นของครามียมออกไซด์ของทับทิมสังเคราะห์	90
19 แสดงความแตกต่างระหว่างเนื้อส่วนที่หลอมกับเนื้อส่วนที่ไม่หลอม	91
20 แสดงความแตกต่างของสารอัดเม็ดที่แรงกดต่างๆ กัน	91
21 แสดงความแตกต่างระหว่างเนื้อหยักที่หลอมกับเนื้อที่อัดเป็นเม็ด	92
22 แสดงค่า Correction Factor ของทับทิมสังเคราะห์	93

รายการตาราง(ต่อ)

ตารางที่	หน้า
23 แสดงค่าเฉลี่ยของ Correction Factor ในแต่ละชุดของหัวทิมสังเคราะห์	94
24 แสดงความเข้มข้นของครามียมออกไซด์เมื่อไม่ได้คูณ Correction Factor	95
25 แสดงความเข้มข้นของครามียมออกไซด์เมื่อคูณ Correction Factor	96
26 แสดงขีดจำกัดการตรวจหาในรูปผังหัวทิม (สารตั้งต้น)	97
27 แสดงขีดจำกัดการตรวจหาในเม็ดหัวทิมสังเคราะห์	97
28 แสดงสภาพไวของตัวอย่างผงและเม็ดหัวทิมสังเคราะห์	98
29 แสดงความเข้มข้นของครามียมและครามียมออกไซด์ ในผงสารตั้งต้นด้วยเทคนิค WDXRF	101
30 แสดงความเข้มข้นของครามียมและครามียมออกไซด์ ในผงสารตั้งต้นด้วยเทคนิค EPMA	109
31 แสดงความเข้มข้นของครามียมและครามียมออกไซด์ ในเม็ดหัวทิมสังเคราะห์ด้วยเทคนิค EPMA	109
32 แสดงความถ่วงจำเพาะของหัวทิมสังเคราะห์ที่ทำขึ้น	116
33 แสดงความถ่วงจำเพาะของหัวทิมสังเคราะห์ที่ซื้อมา	117
34 แสดงความหนาแน่นของผงสารตั้งต้นอัดเม็ด	117
35 แสดงสีที่ถูกดูดกลืนและสีที่ม่องเห็น	151
36 แสดงธาตุและรังสีเอกซ์เฉพาะที่นิยมใช้ทำแอกโนดในหลอดรังสีเอกซ์	165

รายการภาพประกอบ

ภาพประกอบที่	หน้า
1 แสดงแบบจำลองการจัดเรียงตัวของคอร์นดัม	8
2 แสดงโครงสร้างผลึกของคอร์นดัม ที่ได้จากการสร้างภาพด้วยโปรแกรม Xtal	9
3 แสดงอุณหภูมิการเปลี่ยนรูปของอุ่มนิภา	13
4 แสดงໄ/doeagram ของกระบวนการเบเยอร์	16
5 แสดงรูปสันฐานผลึกของคอร์นดัม	21
6 แสดงการสังเคราะห์แบบเพล็มฟิวชัน	22
7 แสดงการสังเคราะห์แบบโซคราลสกี้	24
8 แสดงการสังเคราะห์แบบโฟลทิงโซน	25
9 แสดงการสังเคราะห์แบบฟลักซ์	27
10 แสดงการสังเคราะห์แบบไฮดรเทอร์มอล	29
11 แสดงสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของทับทิม	38
12 แสดงเบ้าอัดทองเหลืองที่ใช้ในการเตรียมสารตั้งต้นในรูปเม็ด	46
13 แสดงเตาเผาแบบที่ 1 ในรูปแบบต่างๆ ; (ก) เตาเผารูปทรงถ้วย แบบที่ (1), (ข) เตาเผารูปทรงถ้วยแบบที่ (2), (ค) เตาเผารูปทรงดัมเบล	48
14 แสดงเบ้าที่ใช้ในการสังเคราะห์ทับทิม	50
15 แสดงเตาเผาแบบที่ 2 ในขณะเปิดเครื่องทำการสังเคราะห์ทับทิม	51
16 แสดงโครงสร้างของเตาเผาแบบที่ 2	52
17 แสดงเครื่องและอุปกรณ์การขัดสูบผลอย	56
18 แสดงการอ่านข้อมูลจากสเปกตัรัม	58
19 แสดงการจัดวางทับทิมสังเคราะห์ในเครื่องยูวีชิเบล	64
20 แสดงการซึ้งน้ำหนักทับทิมสังเคราะห์ในอากาศ	65
21 แสดงการซึ้งน้ำหนักทับทิมสังเคราะห์ในน้ำ	66

รายการภาพประกอบ(ต่อ)

ภาพประกอบที่	หน้า
22 แสดงสีของชิ้นทับทิมสังเคราะห์เมื่อรับความร้อน	68
23 แสดงทับทิมสังเคราะห์ที่เติมโครเมียมออกไซด์ 0.3007%	70
24 แสดงทับทิมสังเคราะห์ที่เติมโครเมียมออกไซด์ 0.5007%	71
25 แสดงスペกตรัมทับทิมสังเคราะห์เมื่อไม่ใช้ตัวกรองรังสี	74
26 แสดงスペกตรัมทับทิมสังเคราะห์เมื่อใช้แผ่นอลูминัมเป็นตัวกรองรังสี	75
27 แสดงスペกตรัมทับทิมสังเคราะห์เมื่อใช้แผ่นเซลลูโลสเป็นตัวกรองรังสี	75
28 แสดงスペกตรัมทับทิมสังเคราะห์เมื่อใช้แผ่นโรเดียมเป็นตัวกรองรังสี	76
29 แสดงถ่ายสารมาตรฐานที่พร้อมในการตรวจวิเคราะห์	78
30 แสดงเม็ดทับทิมสังเคราะห์ในก่อนและหลังการขัดสูบพลอย	78
31 แสดงการวางแผนเม็ดทับทิมสังเคราะห์ในการตรวจวิเคราะห์	79
32 แสดงการวางแผนถ่ายสารมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์	80
33 แสดงスペกตรัมสารปนเปื้อนในอลูมีนา (สารตั้งต้น) โดย EDXRF	83
34 แสดงスペกตรัมของโครเมียมออกไซด์ (สารตั้งต้น) โดย EDXRF	84
35 แสดงスペกตรัมของสำลี (จากการเข็ดเตาเผา)	86
36 แสดงスペกตรัมองค์ประกอบของทับทิมสังเคราะห์ (R9) โดย EDXRF	86
37 แสดงスペกตรัมองค์ประกอบของทับทิมสังเคราะห์ (R10) โดย EDXRF	87
38 แสดงスペกตรัมองค์ประกอบของทับทิมสังเคราะห์ (R11) โดย EDXRF	87
39 แสดงスペกตรัมการกำหนดพื้นที่ให้พิกของธาตุโครเมียม ในทับทิมสังเคราะห์ (R11) โดย EDXRF	88
40 แสดงスペกตรัมองค์ประกอบของทับทิมสังเคราะห์ (R14) โดย EDXRF	88
41 แสดงスペกตรัมของซิลิคอน (สารปนเปื้อน) ในอลูมีนา (สารตั้งต้น) โดย WDXRF	99

รายการภาพประกอบ(ต่อ)

ภาพประกอบที่	หน้า
42 แสดงสเปกตรัมของเหล็กและทองแดง (สารปนเปื้อน) ในอลูмин่า (สารตั้งต้น) โดย WDXRF	99
43 แสดงสเปกตรัมของแกลเลียม (สารปนเปื้อน) ในอลูмин่า (สารตั้งต้น) โดย WDXRF	100
44 แสดงสเปกตรัมของเหล็ก (สารปนเปื้อน) ในโครเมียมออกไซด์ (สารตั้งต้น) โดย WDXRF	100
45 แสดงสเปกตรัมของซิลิคอน (สารปนเปื้อน) ในโครเมียมออกไซด์ (จากขวด) โดย WDXRF	101
46 แสดงสเปกตรัมองค์ประกอบของอลูмин่า (สารตั้งต้น) โดยเทคนิค EPMA	103
47 แสดงสเปกตรัมองค์ประกอบของโครเมียมออกไซด์ (สารตั้งต้น) โดยเทคนิค EPMA	103
48 แสดงการเปรียบเทียบองค์ประกอบของทับทิมสังเคราะห์ (R5) ; — แทนการล้างด้วยสารละลายกรดในติก 0.5 มิลลาร์ 5 ซม., — แทนการไม่ได้ล้าง	104
49 แสดงการเปรียบเทียบองค์ประกอบของทับทิมสังเคราะห์ (R5) ในภาพขยาย, — แทนการล้างด้วยสารละลายกรดในติก 0.5 มิลลาร์ 5 ซม., — แทนการไม่ได้ล้าง	104
50 แสดงองค์ประกอบของทับทิมสังเคราะห์ (R9) โดย EPMA	105
51 แสดงองค์ประกอบของทับทิมสังเคราะห์ (R10) โดย EPMA	105
52 แสดงองค์ประกอบของทับทิมสังเคราะห์ (R11) โดย EPMA	106
53 แสดงองค์ประกอบของทับทิมสังเคราะห์ (R15) โดย EPMA	106
54 แสดงองค์ประกอบของทับทิมธรรมชาติ (N1) ที่ผ่านการล้าง โดย EPMA	107

รายการภาพประกอบ(ต่อ)

ภาพประกอบที่	หน้า
55 แสดงองค์ประกอบของเศษผงเทานลอม โดย EPMA	108
56 แสดงองค์ประกอบของเนื้อเกรฟฟ์ โดย EPMA	108
57 แสดงพีกการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ในอลูมินา	110
58 แสดงพีกการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ในครามียมออกไซด์	111
59 แสดงพีกการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ในผงสารตั้งต้นของหับทิน (Cr_2O_3 0.3007%)	111
60 แสดงพีกการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ในผงสารตั้งต้นของหับทิน (Cr_2O_3 5.0011%)	112
61 แสดงพีกการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ในหับทินสังเคราะห์ที่ทำขึ้น	113
62 แสดงฟิล์มเอกซ์เรย์การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ในหับทินสังเคราะห์ ที่ทำขึ้น (a) และหับทินสังเคราะห์จากวิธีเฟลมฟิวชัน (b)	114
63 แสดงสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของหับทินสังเคราะห์ จากต่างประเทศด้วยวิธีเฟลมฟิวชัน	114
64 แสดงสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของหับทินสังเคราะห์ที่ทำขึ้น	115
65 แสดงสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของสารละลายครามียมออกไซเดต	115
66 แสดงแผนภาพระดับพลังงานของไอออน Cr^{3+} (แผนภาพօอเจล) เฉพาะส่วนที่สำคัญต่อการดูดกลืนแสง	131
67 แสดงกล้อง Debye-Scherrer ในมุมมองแบบ Plan view	153
68 แสดงกล้อง Debye-Scherrer ในมุมมองแบบ Perspective view และวิธีใสฟิล์มแบบของ Straumanis	153
69 แสดงเครื่องดิฟแฟรากโนมิเตอร์สำหรับผง	154
70 แสดงตัวอย่างบัตรข้อมูล PDF ของ NaCl	155

รายการภาพประกอบ(ต่อ)

ภาพประกอบที่	หน้า
71 แสดงเครื่องอิเล็กตรอนไฟฟ้าไมโครแอนาไลต์เชอร์	158
72 แสดงการเปลี่ยนระดับของอิเล็กตรอนที่ทำให้เกิดเส้น K และ L	162
73 แสดงส่วนประกอบของหลอดรังสีเอกซ์แบบ Coolidge	164
74 แสดงแผนภาพองค์ประกอบเครื่อง EDXRF	166